

太陽光モジュールを再利用するための性能測定機器

リユーステスター

PVDシリーズ

IV測定

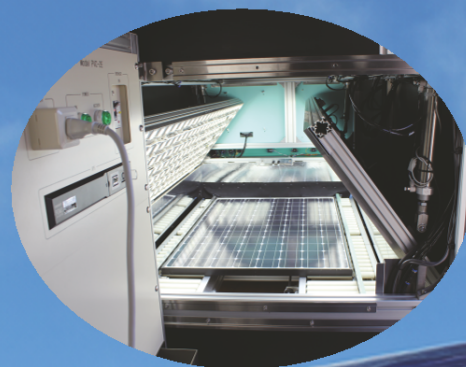
EL測定

バイパス
ダイオード
検査

内部抵抗
測定

絶縁抵抗
測定

太陽光パネルの廃棄を減らし、
SDGsに貢献できるテスター登場!!



計測技術で社会に貢献

SHINEI

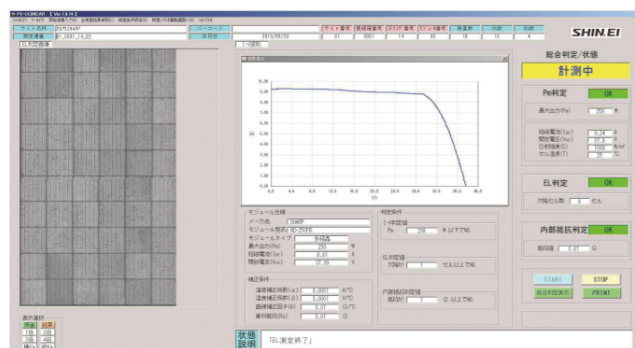


太陽光パネルの廃棄を減らし、 SDGsに貢献できるテスター登場 !!

2021年に環境省よりリリースされたリユース促進ガイドラインに対応した、据え置き型テスター。安定光源をつけることによる検査の信頼性と作業効率の向上で、リユースパネルの生産性をアップさせることを実現しました。導入することでトータルでのコストダウンにも貢献します。

特長

- ◆ 太陽電池モジュールの再利用に必要な性能測定・不良品特定
- ◆ 高性能I-Vカーブトレーサで不良診断
- ◆ 短絡電流・開放電圧・最大出力 など基本性能を正確に測定
- ◆ 白色LED光源にて天候に左右されず測定可能
- ◆ ELカメラでマイクロクラックの検査・EL検査用電源搭載
- ◆ バーコードリーダーで読み取ったパネル情報とパソコンで設定した合否判定をリンク可能
- ◆ 測定結果はシールプリンタで印刷しモジュール良品 / 不良品を識別



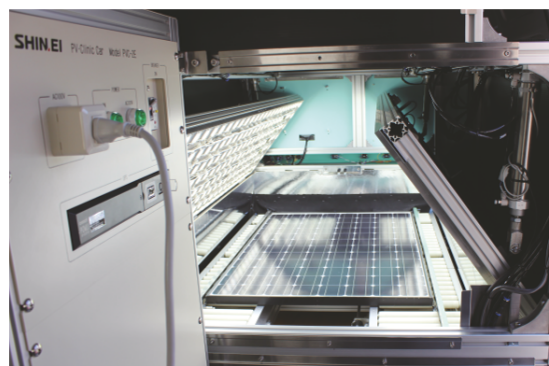
検査項目

- ◆ 発電検査測定 (I-V 特性)
最大出力 (Pm), 短絡電流 (Isc), 開放電圧 (Voc)
最大出力動作電流 (Ipm), 最大出力動作電圧 (Vpm)
FF, 照射強度 (E), モジュール温度 (T)
- ◆ 内部抵抗測定
- ◆ バイパスダイオードの短絡・開放検査
- ◆ 絶縁抵抗測定
- ◆ マイクロクラック検査 (EL 測定)

仕様

- ◆ 最大モジュールサイズ 1200mm×2200mm
- ◆ 最大モジュール出力：600W
- ◆ 外形寸法 W×D×H (mm)：1700×3300×1600 ※突起物を含まず
- ◆ 重量：約 500kg

※2024年現在。製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。
※受注生産になります。



SHIN EI

新栄電子計測器株式会社

〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤 2636

Tel | 0466-88-3030 Fax | 0466-87-0627

Mail | ss_info@shin-ei.ne.jp (営業部宛) <https://www.shin-ei.ne.jp>

